

**Сведения о ведущей организации
по диссертации Торгованова Алексея Игоревича «Методы и техника оценки
параметров мощных СВЧ-транзисторов в полосковых линиях передачи» по
специальности 05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды,
веществ, материалов и изделий» на соискание ученой степени кандидата
технических наук**

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное унитарное предприятие РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики филиал «Научно исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» филиал «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
Место нахождения	г. Нижний Новгород
Почтовый индекс, адрес организации	603137, Нижний Новгород, ул. Тропинина, 47
Телефон (при наличии)	(831) 465-49-90
Адрес электронной почты (при наличии)	e-mail: niiis@niiis.nnov.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии)	сайт: http://www.niiis.nnov.ru/

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1.	Макеев, А.С. Компактная SPICE-модель КНИ МОП-транзистора для проектирования спецстойких СБИС с проектными нормами 0.35 мкм / А.С. Мокеев, С.В. Карачкин // Проблемы разработки перспективных микро- и нанoeлектронных систем (МЭС). 2017 №3. – С.155-158.
2.	Венедиктов, М.М. Оценка воздействия ионизирующих излучений на электронные компоненты по результатам испытаний ограниченных выборок / М.М. Венедиктов, Е.С. Оболенская, В.К. Киселёв, С.В. Оболенский // Журнал радиоэлектроники. 2017. №1. С.7.
3.	Венедиктов, М.М. Распределение критической мощности при исследовании стойкости к воздействию импульса электрической мощности в биполярных транзисторных структурах / М.М. Венедиктов, В.К. Киселёв // Вопросы атомной науки и техники: серия Физика радиационного воздействия на радиоаппаратуру. 2015. №2. С.5-11.
4.	Мокеев, А.С. Масштабируемая макромодель диода с повышенной точностью моделирования / А.С. Мокеев, А.Н. Мансуров, А.П. Ятманов // Проблемы разработки перспективных микро- и нанoeлектронных систем (МЭС). 2014. № 1. С. 89-94.
5.	Киселёв, М.Р. К вопросу о физических механизмах генерации фликкерного шума в TI-AU/GAAS диодах Шоттки / М.Р. Киселёв, А.В. Клюев, А.В. Клюев // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 1-2. С. 158-162.
6.	Киселёв, В.К. Аналитическая модель деградации характеристик кремниевых биполярных транзисторов с тонкой базой при воздействии дефектообразующих излучений / В.К. Киселёв, С.В. Оболенский, А.С. Пузанов // Вестник Нижегородского университета им. Лобачевского. 2013. №2-1. С.56-59.

Верно

Учёный секретарь
диссертационного совета



Белов Юрий Георгиевич